Andrzej BADZIAN Andrzej KŁOKOCKI Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Metoda badań rentgenowskich struktury pasmowej ciał stałych na przykładzie miedzi

WSTEP

Podstawą opisuwielu zjawisk fizycznych w ciałach stałych jest ich struktura elektronowa; istnieje przy tym współzależność między tą strukturą /gęstość stanów pasm energetycznych/ a strukturą krystalograficzną przestrzenny rozkład atomów/. Najbardziej istotne jest tutaj zachowanie się funkcji gęstości stanów w pobliżu poziomu Fermiego i dlatego przedmiotem badań jest struktura energetyczna pasma walencyjnego i pasma przewodnictwa.

W badaniach widm rentgenowskich informacje o strukturze tych pasm można uzyskać z widm emisyjnych i absorpcyjnych, chociaż istnieją duże trudności w ich interpretacji fizycznej, które są przeszkodą w otrzymaniu czystej funkcji gęstości stanów. Jest to bardzo aktualny problem, gdyż teoria widm rentgenowskich, opracowana przez Mahana w oparciu o teorię wielu ciał wyjaśnia w sposób zadowalający widma absorpcyjne iemisyjne lekkich metali /1/7.

Dążenie do ujawnienia subtelnej struktury funkcji gęstości stanów stawia warunek wysokiej zdolności rozdzielczej metodom spektralnym stosowanym w tego rodzaju badaniach. Szczególne osiągnięcia na tym polu należą do spektrometrii fotoelektronów, wzbudzanych promieniowaniem nadfioletowym /zdolność rozdzielcza 0,2 eV/ i rentgenowskim /1,0 eV/ [2].

W badaniach rentgenowskich sukcesy spektrometrii miękkich widm /serie L, M, N/ spowodowały zmniejszenie zainteresowania widmami serii K. Mniejsza zdolność rozdzielcza osiągana w widmach K tłumaczona jest dużą szerokością energetyczną poziomu K w porównaniu z szerokością poziomów L, M, Z drugiej strony, poziom K jest poziomem pojedynczym, w przeciwstawieniu do bardziej złożonej struktury poziomów L i M, która komplikuje interpretację widm wyższych serii. Istnieje także brak spójnoś-

ci wyników otrzymanych za pomocą spektrometrii miękkich widm i serii K.

W tej sytuacji przedmiotem badań była weryfikacja poglądów na temat użyteczności spektrometrii widm K. W tym celu zbudowano spektrometr o wysokiej zdolności rozdzielczej i przeprowadzono badania widm emisyjnych i absorpcyjnych miedzi. Badania tych widm, jako metoda określania struktury pasmowej, są jednym ze sposobów charakteryzacji materiałów elektronicznych. W Polsce prace w tej dziedzinie prowadzone są w Instytucie Fizyki PAN przez zespół pod kierunkiem prof. J. Auleytnera.

CZESC DOSWIADCZALNA

W pracy badano pasmo walencyjne miedzi przy zastosowaniu rentgenowskiej spektroskopii emisyjnej widm serii K. Obserwowano linię CuK $\beta_{2,5}$ występującą przy przejściu elektronów z pasma walencyjnego na poziom K. W tym celu zbudowany został spektrometr rentgenowski o dużej zdolności rozdzielczej, działający następująco (3/.

Wiązka elektronowa, wzbudzająca promieniowanie rentgenowskie, była ogniskowana elektrostatycznie lub magnetycznie na miedzianej anodzie. Promieniowanie rentgenowskie wychodziło z anody pod małym kątem, około 5⁰. W takim przypadku efektywna wielkość ogniska nie przekraczała 20 µm. Promieniowanie padało na stacjonarny kryształ analizujący spektrometru. Kryształem tym był krzem z wyciętą płaszczyzną krystalograficzną /535/. Padajaca wiazka promieniowania była rozbieżna. Tak wybranapłaszczyzna odbijająca w krzemie zapewniała dużą zdolność rozdzielczą urządzenia podczas rejestracji promieniowania przy dużych kątach Bragga /8 ≈ 79⁰/. Po odbiciu od kryształ promieniowanie było rejestrowane na kliszy fotograficznej. Kryształ analizujący i film były umieszczone W komorze próżniowej /10⁻³mm Hg/, posiadającej berylowe okno na wejściu promieniowania. Rejestrowany kształt emisyjnego pasma CuK $p_{2.5}$ był określany za pomocą fotometru. Odległość pomiędzy źródłem promieniowania a kryształem analizującym wynosiła 350 mm, natomiast między kryształem a filmem 210 mm. W tych warunkach dyspersja na filmie wynosiła 2,9 eV/mm, a zdolność rozdzielcza 0,5 eV. Czas ekspozycji wynosił około 300 godzin, przy napięciu przyspieszającym 25 kV i prądzie 0,2 mA. Otrzymany kształt linii emisyjnej CuK_{P 2.5} jest bardzo czuły na wielkość ogniska otrzymywanego na anodzie lampy. Przy gorszym zogniskowaniu wiązki elektronów, kiedy efektywna wielkość ogniska przekraczała 20 um, można było zaobserwować pojedyncze rozmyte maksimum w paśmie CuK ß 2 5.

Otrzymany eksperymentalnie kształt widma przedstawiony jest na rysunku 3. Jest on wyraźnie asymetryczny. Część długofalowa wykazuje łagodny przebieg, podczas gdy w części krótkofalowej obserwuje się gwałtowną zmianę intensywności. W widmie obserwuje się dwa maksima odległe odsiebie o 2,7 eV. Ich położenie określone jest na podstawie równocześnie rejestrowanej na filmie linii CuK $\beta_{1,3}$ [4].

Szerokość połówkowa krzywej wynosi około 4,5 eV. Przedstawiona krzywa jest krzywą eksperymentalną. Nie uwzględniono poprawek na rozmycie aparaturowe, szerokość poziomu K oraz auto-absorpcję.



Rys. 1. Diagram przejść elektronowych dla różnych serii widm rentgenowskich

Przeprowadzono także równoczesny pomiar linii emisyjnej CuK $\beta_{2,5}$ i krawędzi absorpcji miedzi. Na jego podstawie można stwierdzić, że położenie K – krawędzi absorpcji nie różni się, z dokładnością pomiaru, od położenia krótkofalowego zbocza linii emisyjnej. Przeprowadzono także pomiar K-krawędzi absorpcji miedzi, stosując promieniowanie z anody platynowej. Otrzymane absorpcyjne widmo jest podobne do krzywej publikowanej przez Yeha i Azaroffa [5], ale główna krawędź absorpcji jest węższa energetycznie /otrzymana szerokość jest mniejsza niż 0,7 eV/.



Rys. 2. Zasada działania spektrometru, S - mikroogniskowa lampa rentgenowska, C - kryształ analizator, F - film



Rys. 3. Emisyjne widmo CuK β_{2} oraz K-krawędź absorpcji. Obie krzywe są nie poprawiane. Intensywność J i współczynnik absorpcji α wyrażone w jednostkach względnych

DYSKUSJA WYNIKOW

Rentgenowska spektroskopia widm serii K nie była do tej pory zbyt często stosowane w badaniach pasma walencyjnego miedzi, jak również innych metali i związków. Jest jednak kilka prac stosujących tę metodę /Beeman i Friedman /6/. Nemoskalenko i in. /7/. Nikiforow i Błochin /8//. We wszystkich tych pracach używano spektrometru dwukrystalicznego. Autorzy stosowali różne kryształy jako analizatory. Dla porównania przedstawiamy eksperymentalne wyniki otrzymane w tych pracach. W obu rosyjskich pracach wyniki są podobne. Obserwuje się dwa maksima w paśmie emisyjnym, odległe od siebłe o 4 eV, a szerokość połówkowa krzywej wynosi około 8 eV. Beeman i Friedman otrzymali widmo z jednym maksimum, jedynie po stronie krótkofalowej obserwuje się przegięcie krzywej. Szerokość połówkowa krzywej wynosi także około 8 eV.

Nemoskalenko i współautorzy stwierdzają, że trudno jest podać jednoznaczną interpretację dla powstawania emisyjnego pasma K $\beta_{2,5}$ i sugerują następujące mechanizmy:

- a/ pasmo K ß 2,5 powstaje na skutek kwadrupolowego przejścia pomiędzy stanami 3d ls. Rozkład intensywności w paśmie emisyjnym, określony przez prawdopodobieństwo przejścia, przedstawia rozkład stanów elektronowych o symetrii d w zewnętrznym paśmie energetycznym,
- b/ pasmo K p 2,5 wyraża rozkład przeważających stanów o symetrii d w paśmie walencyjnym, ale jego intensywność jest nieznacznie większa od intensywności odpowiadającej czystemu przejściu kwadrupolowemu d - s, z powodu niewielkiej domieszki stanów o symetrii p i tworzenia się shybrydyzowanych stanów typu spd,
- c/ pasmo K_{β2.5} określone jest przez dipolowe przejście 4p- ls i oddaje rozkład stanów o symetrii p w paśmie walencyjnym. Stany takie,

Stany takie, chociaż nie występują w izolowanych atomach Cu, pojawiają się w sieci krystalicznej w rezultacie przekrywania się stanów osymetrii s, p i d.

Nemoskalenko sugeruje, że ostatni mechanizm powstawania pasma emisyjnego CuK $\beta_{2,5}$ jest najbardziej prawdopodobny. Porównuje on swój eksperymentalny wynik, poprawiony ze względu na rozmycie aparaturowe i szerokość poziomu K, z emisyjnym pasmem CuL α_I , otrzymanym przez Nemnonowa i in. [9] i teoretyczną funkcję gęstości stanów podaną przez Burdicka

[10]. Twierdzi on, że widma CuL_{d 1} i CuK_{β 2,5} muszą określać przejścia elektronowe z zewnętrznych poziomów energetycznych o różnej symetrii. Uważa, że wąskie pasmo emisyjne CuL_{d 1}, które powstaje przy przejściu elektronu pomiędzy stanami 3d – 2p, określa symetrię stanów d w paśmie walencyjnym, natomiast pasmo CuK_{β 2,5} oddaje symetrię elektronów p. Pasma emisyjne innych serii widma rentgenowskiego dla przejść z poziomu M_{LV,V} były wielokrotnie badane. Przykładowo szerokość połówkowa pasma emisyjnego podawana była jako: 3 eV dla serii L /L_{III}, M_{IV,V} przez Bonelle /ll/; 5 eV także dla serii L przez Kostera /l2/; 4,5 eV dla serii M /M_{II III}, M_{IV,V} przez Dobbyna i in. /l3/.

Struktura pasma walencyjnego miedzi oraz innych metali przejściowych badana była także techniką spektroskopii fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim /XPS/ lub promieniowaniem nadfioletowym/UPS/.

Tutaj także występują różnice w wynikach podawanych przez różnych autorów. Systematyczne badania metali przejściowych były przeprowadzone przez Fadleya i Shirleya /147. Widma tych pierwiastków /Fe, Co, Ni, Cu/ nie wykazują żadnej subtelnej struktury. Obserwuje się natomiast zwężenie szerokości połówkowej widma wraz ze wzrostem liczby atomowej. Berglund i Spicer /15/ otrzymali natomiast dla miedzi widmo z dwoma maksimami odległymi od siebie o 1 eV, wiążącymi się ze strukturą pasma 3d. Höfner i współautorzy /16/ otrzymali krzywą z pojedynczym maksimum, której przebieg dobrze pasuje do krzywej gęstości stanów podanej przez Burdicka. Wszystkie te wyniki otrzymano techniką XPS. Lindau i Hägstrom [17] przedstawiają widmo miedzi otrzymane techniką UPS. Pomiar ich przeprowadzony został z dużą zdolnością rozdzielczą. Rezultaty przedstawiono na rysunku 4. Widmo związane z elektronami 3d wykazuje pewną subtelną strukturę, jest wąskie, szerokość połówkowa wynosi około 2 eV, a wysokoenergetyczne zbocze jest oddalone od poziomu Fermiego o około 2 eV. Uważa się obecnie, że ze względu na największą zdolność rozdzielczą technika UPS daje najlepsze wyniki w badaniach widm pasma walencyjnego ciał stałych.



Rys. 4. Widmo fotoełektronów Cu wzbudzonych energią 21,2 eV. /Lindau, Hagström/

W literaturze znajduje się szereg prac teoretycznych, przedstawiających obliczoną gęstość stanów elektronowych. Dla miedzi pierwsza praca wykonana przez Rudberga i Slatera /187 ukazała się w 1936 r. Na rys. 5 przedstawiamy trzy przykłady teoretycznej gęstości stanów miedzi, wybrane spośród wielu prac publikowanych w ostatnich latach. Krzywa przedstawiona przez Burdicka /107 jest wąska i obserwuje się w niej pojedyncze maksimum. Brak subtelnej struktury funkcji gęstości stanów spowodowany jest użyciem zbyt dużego kroku w konstrukcji histogramu.Rezultaty, otrzymane przez Stocksa i in. /19/ oraz Goodingsa i Harrisa [29], są podobne i wykazują subtelną strukturę pasma 3d. Pasma 4s i 4p są rozciągnięte. Ich gęstość stanów w obszarze energii, gdzie występuje znaczna gęstość stanów w paśmie 3d, jest niewielka. Poziom Fermiego jest oddalony o około 2 eV od ostrego zbocza pasma 3d. W obecnym czasie wyniki tych prac wydają się być najbardziej wiarygodne.



W wielu pracach istaniała tendencja do porównywania eksperymentalnego widma emisyjnego z krzywą gęstości stanów. Bardzo często obie krzywe mają podobny kształt, zbliżoną szerokość połówkową. Podobieństwo pomiędzy funkcją gęstości stanów N/E/ i intensywnością widm wynika z klasycznej teorii widm rentgenowskich, która określa

$$N/E/\sim \int_{S} d^2 k \frac{1}{\nabla_k E}$$
 /1/

$$I/E//\sqrt{2} \sim \int d^2 k \frac{1}{\nabla_k^E} |\Psi_k \nabla_x \Psi_f d\tau|^2 /2/$$

qdzie I/E/ intensywność promieniowania, E-energia stanu o wektorze falowym k, a całkowanie odbywa się po powierzchni S stałej energii E. Ψ i Ψ_{f} oznaczają funkcje falowe stanu - odpowiednio: początkowego i końcowego. Kwadrat modułu elementów macierzowych $|(\Psi, \nabla, \Psi, d\tau)^2$ to prawdopodobieństwo przejścia P/E/.

Stad I/E//
$$y_3 \sim N/E/\cdot P/E/$$

oraz

131

Zakłada się tutaj, że prawdopodobieństwo przejścia P/E/ jest niezależne od wektora falowego k oraz że przy uśrednieniu prawdopodobieństwa przejścia mierzona intensywność widma jest proporcjonalna do funkcji gęstości stanów.

Założenie to nie jest jednak prawidłowe. Ponieważ elementy macierzowe są funkcją wektora falowego k, nie jest możliwe wyniesienie prawdopodobieństwa przejścia przed całkę w równaniu 2, a więc nie można traktować wyrażenia na intensywność promieniowania jako iloczynu funkcji gęstości stanów i średniego prawdopodobieństwa przejścia. Rooke [21] pokazał, że zależność elementów macierzowych od k jest wyraźna i może się zmieniać w prawie całym zakresie od 0 do 1 dla danej krzywej stałej energii, w związku z czym wynoszenie elementów macierzowych przed całkę może prowadzić do poważnych błędów.

Mahan /22/ pokazał także, że nie uwzględnianym do tej pory czynnikiem w rozważaniach widm rentgenowskich ciał stałych, a mającym znaczny wpływ na kształt widma, jest tzw. oddziaływanie stanu końcowego. W lekkich metalach, jak Al, efekt oddziaływania stanu końcowego jest mały. Jest także możliwy do zaniedbania w półprzewodnikach, ale w metalach ta-

kich jak Cu, jak również w izolatorach z dużą przerwą energetyczną, efekt ten ma duże znaczenie. Na podstawie teorii wielu ciał Mahan /1/ pokazuje, że zarówno w procesach emisji, jak i absorpcji, związanych z elektronami przewodnictwa o energiach bliskich energii Fermiego, w widmach występują tzw. osobliwości progowe. Np. współczynnik absorpcji w pobliżu progu ma następującą zależność częstotliwościową:

$$A/\omega/ = \left/\frac{z_0}{\omega - \omega_{\rm T}}\right)^{\alpha_{\rm T}} f/\omega/\theta/\omega - \omega_{\rm T},$$

gdzie:

/()/ jest funkcją stopnia, w której m oznacza energię progową, f/w/ jest gładką funkcją,

3 - energia pasma energetycznego o wielkości zbliżonej do poziomu Fermiego,

Al jest złożonym współczynnikiem, związanym między innymi z oddziaływaniem pary elektron-dziura, powstałej przy przejściu elektronowym.

Eksperymentalne wyniki dla lekkich pierwiastków dobrze zgadzają się z teorią.

Dla metali przejściowych Doniach i Sunjic [23] sugerują występowanie podobnego mechanizmu, co mogłoby się objawiać pochyłym kształtem emisyjnych linii widmowych serii K.

Z powyższych rozważań wynika, że funkcja gęstości stanów nie możebyć określana wprost z intensywności widma rentgenowskiego. Muszą być uwzględnione znaczące poprawki na zmianę elementów macierzowych prawdopodobieństwa przejścia z energią oraz efekt ekscytonowy.

Przedstawiona przez nas krzywa, określająca pasmo emisyjne CuK $\beta_{2,5}$ miedzi, jest wyraźnie węższa niż w pracach Nemoskalenki [7] oraz Beemana i Friedmana [6]. Występują na niej dwa wyraźne maksima. Na podstawie przedstawionej dyskusji można podać następującą interpretację otrzymanego widma:

- 1/ wysokoenergetyczna część pasma emisyjnego ma wyraźnie pochyły kształt Zbocze krótkofalowe jest zdecydowanie ostre. Kształt ten podobny jest do widm emisyjnych lekkich metali, przedstawionych przez Mahana, w których obserwuje się występowanie osobliwości progowych,
- 2/ wydaje się, że wysokoenergetyczna część widma związana jest z przejściem elektronowym ze stanu ls do mieszanych stanów spd. W tym obszarze energii gęstość stanów d jest mała, porównywalna z gęstością stanów p. Natomiast prawdopodobieństwo przejścia pomiędzy stanami ls – 4p opierając się na rachunkach przeprowadzonych dla swobodnych atomów 2/247, jest około 20 razy większe od prawdopodobieństwa przejścia ls – 3d, Można więc stwierdzić, że w wysokoenergetycznej części widma decydujące jest przejście spełniające dipolowe reguły wyboru / Δ l = ± 1/ pomiędzy stanami ls – 4p,
- 3/ część niskoenergetyczna widma związana jest z innymi przejściami elektronowymi. Odległość pomiędzy poziomem Fermiego akrótkofalowym zboczem niskoenergetycznej części widma wynosi około 2,2 eV, co dobrze się zgadza z wynikami Lindaua i Hagströma. Nie obserwujemy subtelnej struktury widma występującej u tych autorów, ale ich eksperyment prowadzony był z większą zdolnością rozdzielczą. Niskoenergetyczna część widma emisyjnego CuK $p_{2,5}$ jest wąska. Szerokość połówkowa wynosi około 2,1 eV. W tym obszarze energii gęstość stanów d jest zdecydowanie wyższa niż stanów p /około 30 razy (20). Mała szerokość połówkowatej części widma emisyjnego, położenie względem poziomu Fermiego i duża gęstość stanów d sugerują, że niskoenergetyczna część widma związana

jest z kwadrupolowym przejściem $/\Delta 1 = 0, \pm 2/$ pomiędzy stanami 1s — 3d. Stany 3d są zlokalizowane i wąskie energetycznie.

Spektroskopia widmserii k związana jest z przejściem elektronu na poziom ls /K/. Bishop i in. (25) przedstawiają zależność szerokości poziomu K od liczby atomowej Z. Dla lekkich metali, np. Al, szerokość poziomu K wynosi około 0,4 eV, dla Cu - ok. 1,5 eV, a dla pierwiastków o liczbie atomowej Z większej niż 38 szerokość poziomu K jest większa od 3 eV. Szerokość poziomu K jest szybko rosnącą funkcją liczby atomowej Z. Pasmo emisyjne jest opisywane jako splot funkcji określających stan początkowy i końcowy w przejściu elektronowym. Zgodnie z tym można przypuszczać, że obserwacja pewnych subtelnych szczegółów widma, jak np. ostre zbocze wysokoenergetycznej części widma, związana jest z mniejszą szerokością poziomu K niż się do tej pory uważało.

WNIOSKI

- Pomiary wykonano na jednokrystalicznym spektrometrze rentgenowskim, współpracującym z mikroogniskową lampą rentgenowską lub mikroskopem elektronowym, co zapewniało wysoką zdolność rozdzielczą.
- 2. Emisyjne widmo CuK $\beta_{2,5}$ jest węższe niż publikowane dotychczas.
- 3. Porównując wynik naszych badań z teoretyczną gęstością stanów Cu i pracami ze spektroskopii fotoemisyjnej, należy sądzić, że za powstanie pasma CuK $\beta_{2,5}$ odpowiedzialne są dwa rodzaje przejść elektronowych.
- W niskoenergetycznej części widma decydujące jest kwadrupolowe przejście pomiędzy stanami 1s — 3d. Stany 3d są częściowo zlokalizowane.
- W części wysokoenergetycznej występuje dipolowe przejście 1s 4p a stany s, p i d są tutaj shybrydyzowane.
- Ostre zbocze, zaobserwowane w pasmach emisyjnym i absorpcyjnym, potwierdzają przyjęte przez Mahana założenie o osobliwości progowej związanej z poziomem Fermiego.
- 7. Wskazano na możliwość osiągnięcia wyższej zdolności rozdzielczej spektroskopii rentgenowskiej widm serii K i jej zalety interpretacyjne, wynikające z pojedynczego i wąskiego poziomu K.

LITERATURA

1. G.D. Mahan, Sol. State Phys. 29, 75, 1974. 2. L.V. Azaroff: X-Ray Spectroscopy, ed. L.V. Azaroff, Mc Graw-Hill, 402, 1974. 3. A. Baizian, A. Kłokocki: Urząd Patentowy PRL, zgłoszenie nr P-220839, 1979. 4. Y.A. Bearden: Rev. Mod. Phys. 39, 78, 1967. 5. H.C. Yeh, L.V. Azaroff: Appl. Phys. Lett. 6, 207, 1965. 6. W.W. Beeman, H. Friedman: Phys. Rev. 56, 392, 1939. 7. V.V. Nemoskalenko, M.A. Mindlina, B.P. Mamko: Phys. Stat. Sol. 30, 703, 1968. 8. I.Ya. Nikiforow, M.A. Błochin: 1zv. Akad. Nauk SSSR Ser. fiz. 28, 786, 1964. 9. S.A. Nemnonow, V.G. Zupanow, V.F. Wołkow: Fiz. Metali 22, 275, 1966. 10. G.A. Burdick: Phys. Rev. 129, 138, 1963. 11. C. Bonnelle: Soft X-Ray Band Spectra, Academic Press, 163, 1968. 12. A.S. Koster, Molecular Phys. 26, 625, 1973. 13. D.C. Dobbyn, M.L. Williams, J.R.Cuthill, A.J. Mc Alister: Phys. Rev. 82, 1563, 1970, 14. C.S. Fadley, D.A. Shirley: Natl.Bur.Std., J.Res., A 74, 543, 1970. 15. C.W. Berglund, W.E. Spicer: Phys.Rev. 136, 1044, 1964. 16. S.Hüfner, G.K. Wertheim, J.H.Wermick: Phys. Rev. B 8, 4511, 1973. 17. I. Lindau, S.B.M. Hagström: X-Ray Spectroscopy, ed.L.V.Azaroff, Mc.Graw-Hill 404,1974. 18. E. Rudberg, J.C. Slater: Phys. Rev. 50, 150, 1936. 19. G.H. Stocks, R.W. Williams, J.S. Faulkner: Phys. Rev. B 4, 4390, 1971. 20. D.A. Goodings, R. Harris; J.Phys. C 2, 1808, 1969. 21. G.A.J. Rooke, J.Phys. Chem., 1, 767, 1968. 22. G.D. Mahan: Natl. Bur. Std., J.Res. 74 A, 267, 1970. 23. S. Doniach, M. Sunjic: J.Phys. C 3, 285, 1970, 24. Y.H. Soefield: Phys. Rev. 179, 9, 1969. 25. D.M. Bishop, M.Radnic, J.R. Morton: Jurn.Chem.Phys. 45, 1880, 1966.

Elżbieta OTTO Andrzej HRUBAN Waldemar BRZOZOWSKI Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Mechaniczno-chemiczne polerowanie monokrystalicznych płytek związków A^{III} B^V

WSTEP

Wtechnologii wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych stosuje się monokrystaliczne płytki GaAs i GaP jako materiał czynny tych przyrządów, bądź jako podłoża do osadzania warstw epitaksjalnych. Technologia otrzymywania warstw epitaksjalnych na płytkach podłożowych, a także technologia produkcji elementów półprzewodnikowych wytwarzanych bez epitaksji, stawia bardzo wysokie wymagania jakości powierzchni płytek. Istotnymi